

Codul disciplinei DIS404M

Numar credite 6

Specializarea

Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii

Obiective

Prezentarea modelelor de defecte logice utilizate in tehnologiile actuale. Prezentarea tehnicilor de simu

Descriptori

Defecte logice, defecte fizice. Detectia si localizarea defectelor. Generarea t

Documente

[Fisa disciplinei](#) |

[Programa analitica](#)

Resurse Internet

Pagina cursului |

[Moodle](#)

Titular

Conf.dr.ing.

[Damian Imbrea](#) (curs, laborator)

{backbutton}